

針對內建人工智慧之車用晶片且以[零故障]為目標之智慧型測試方式  
會議記錄

時間：2022年4月8日（星期五）下午4:00~5:00

舉行方式：google meet 線上會議 <https://meet.google.com/ouv-oyko-emr>

參加者：

清華大學 黃錫瑜 教授

林昂德 碩士生

楊舜華 碩士生

林科宏 碩士生

蘇永全 碩士生

王逸生 碩士生

鄧向凱 碩士生

賴淇 碩士生

交通大學 溫宏斌 教授

王品棠 DRI

中山大學 李淑敏 教授

李建德 DRI

彰師大 黃宗柱 教授

傅筱雯 DRI

議程：

- (1) 專題分享 - 交通大學(Existence of Single-Event Double-Node Upsets (SEDU) in Radiation-Hardened Latches for Sub-65 nm CMOS Technologies)
- (2) General project discussion

下次月會綱要:

- (1) 舉行時間：2022/05/13
- (2) 舉行方式：google meet 線上會議
- (3) 技術分享(中山大學)
  - i. Topic : Semi-Supervised Framework for Wafer Defect Supervised Pattern Recognition with Enhanced Labeling
  - ii. 主講者：陳立揚
- (4) General project discussion